

BACK-END

MOS-FET

IGBT

THYRISTOR

DIODE

ZENER DIODE

SEMICONDUCTOR TEST SYSTEM 半導体テストシステム

CHTS3050Z 3000V
500A

- CHTS3050Z is DC test system for measuring MOS-FET, IGBT and diode as well as thyristor and zener diode. The external units are arranged with 12 pin programmable scanners and high current sources, and the system configuration is designed with production facilities in mind.
- 本器は MOS-FET、IGBT、ダイオードに加え、サイリスタ、ツェナーダイオードの測定にも対応した DC テストシステムです。外置きのユニットは 12 ピンプログラマブルスキャナと大電流源が配置されており、生産設備を考慮したシステム構成となっています。



MODEL	CHTS3050Z
SOFTWARE	
TEST PLAN/SORT PLAN	1000/1000
BIN OUT	24
DC UNIT	
MEASURABLE DEVICES	MOS-FET, IGBT, THYRISTOR, DIODE, ZENNER DIODE
VOLTAGE/CURRENT	3000V/500A
TEST ITEMS	
MOS-FET	Idss, Idsr, Idsx, Igss, BVdss, BVdsr, BVdsx, BVsgs, VfSDS, VfSDX, VGsth, VTH, VdsON, RdsON, LVdsON, LRdsON, IdON, DHIdss, GMP
IGBT	ICES, ICER, ICEx, IGES, BVces, BVcer, BVcex, BVEGS, VFECs, VGeth, VTH, VceON, ICON, GMP
THYRISTOR	IDRM, IRGM, VRGM, Vgk, Igk, VTM, VGT, IGT, IH, VDRM
DIODE	IR, VR, VF
ZENNER DIODE	Iz, Vz, Vf, Zz, ZZCB, ZZEB, RZ, RZCB, RZEB
DIMENSIONS & WEIGHT	
MAIN UNIT	550(W)×860(D)×1100(H)…150kg
HIGH CURRENT UNIT	430(W)×650(D)×240(H)…39kg
SCANNER UNIT	430(W)×650(D)×330(H)…39kg